



### 特点

- 测试频率 20Hz~200kHz/1MHz, 精确度0.02%
- 基本量测准确度:0.1%
- 三种阻抗输出模式选择, 量测结果与各家知名厂牌之LCR表完全比对
- 增强式圈数比(Turn Ratio)准确量测, 适用于低磁导率之磁心
- 高速LCR量测, 最快80次/秒
- 高速DCR量测, 最快50次/秒
- 对于扫描频率、电压与重叠电流量测, 提供图形和表格显示方式(3252/3302)
- 内建8mA重叠电流, 供RJ45传输变压器环境使用 (选购,限出货前安装)
- 对于电视Inverter变压器, 提供漏感100Bin分类与漏感平衡功能
- 对于MLCC(积层陶瓷电解电容)量测, 提供ALC (自动位准补偿)功能(3252/3302)
- 对于变压器、电感量测, 提供治具杂散容量补偿功能
- 1320直流重叠电流源直接控制功 (3252/3302)
- 大型LCD显示(320x240点矩阵)
- 提供各式标准测试治具及特殊治具订制
- 四端测试治具, 可得到DCR、电感量和圈数比之精确且稳定之量测
- 内建式比较器;10级分类(bin sorting)及计数功能 (3252/3302)
- 以电感量测值为漏感中心值功能, 提供充电器内变压器应用
- 4M SRAM记忆卡供机台资料设定及备份
- 标准RS232, HANDLER, PRINTER介面, 支援LCR功能GPIB介面 (选购)
- 15组内部仪器设定可供储存及呼叫



3250/3252/3302变压器测试系统, 为一提供变压器生产或品管进出料检验, 具有高稳定度及高可靠度之精密量测仪器。3250/3252提供20Hz-200kHz测试频率, 3302则提供20Hz-1MHz测试频率。在变压器扫描测试项目上, 涵盖各式变压器之低压测量参数。包括电感量, 漏感量, 圈数比, 直流电阻, 阻抗, 线圈间容量等主参数; 品质因素, 串联等效电阻等副参数, 以及出脚短路检查等。高速数位取样技术及扫描测试治具(A132501)设计, 使以往费时低效率的变压器生产检验变得精确又快速。

3250/3252/3302更提供多种输出阻抗模式的选择, 使得测试仪器间因测试输出阻抗差异造成测试电流不同而引起之量得电感量差异之问题得以解决。另外, 在圈数比测量技术上更提供电感量换算方式选择, 可改善低耦合系数变压器因漏磁比例过高引起之圈数比量测误差问题。

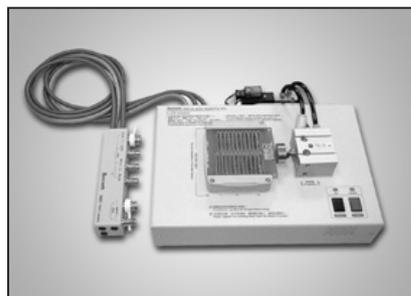
3252/3302除了提供变压器扫描的测试功能外, 也提供LCR Meter功能, 可应用于各式零件之进出料检验, 研发分析或生产线自动化应用。



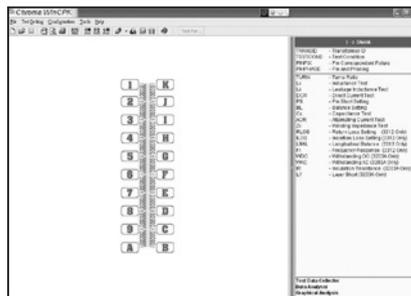
Model 3302

### 订购资讯

- 3250**: 自动变压器测试系统
- 3250**: 自动变压器测试系统 (含8mA重叠电流)
- 3252**: 自动零件分析仪
- 3252**: 自动零件分析仪 (含GPIB介面)
- 3302**: 自动零件分析仪
- 3302**: 自动零件分析仪 (含GPIB介面)
- 3302**: 自动零件分析仪 (含8mA重叠电流)
- 3302**: 自动零件分析仪 (无变压器扫描测试)
- A110104**: SMD测试线#17
- A110211**: 零组件测试盒
- A110212**: 零组件远端测试盒
- A110234**: 高频测试线
- A110239**: 四端SMD电解电容测试盒(有专利)
- A113012**: 真空产生器(搭配A132574使用)
- A113014**: 真空汞浦(搭配A132574使用)
- A132501**: 变压器自动扫描测试盒(3001A)
- A132563**: WINCPK变压器测试资料统计分析软体 (USB埠软体保护器)
- A132574**: SMD Power Choke测试治具
- A133004**: SMD测试盒
- A133006**: 1A重叠电流源装置
- A133019**: BNC测试线2M (单边开放)



**A132501**: 变压器自动扫描测试盒(3001A)



**A132563**: WINCPK变压器测试资料统计分析软体

规格表		3250	3252	3302
<b>Model</b>		3250	3252	3302
<b>Main Function</b>		Transformer Scanning Test	Transformer Scanning Test + LCR Meter	
<b>Test Parameter</b>		Turn Ratio, Phase, Turn, L, Q, Leakage L, Balance, ACR, Cp, DCR, Pin Short		
LCR METER		--	L, C, R,  Z , Y, DCR, Q, D, R, X, $\theta$ , Ratio (dB)	
<b>Test Signals Information</b>				
Test Level	Turn	10mV~10V, $\pm 10\%$ 10mV/step		
	Others	10mV~2V, $\pm 10\%$ 10mV/step		
Test Frequency	Turn	1kHz~200kHz, $\pm (0.1\% + 0.01\text{Hz})$ , Resolution: 0.01 Hz		1kHz~1MHz, $\pm (0.1\%+0.01\text{Hz})$ , Resolution : 0.01 Hz
	Others	20Hz~200kHz, $\pm (0.1\% + 0.01\text{Hz})$ , Resolution : 0.001 Hz (<1kHz)		20Hz~1MHz, $\pm (0.1\%+0.01\text{Hz})$ , Resolution 0.001 Hz (<1kHz)
Output Impedance Display	Turn	10 $\Omega$ , when level $\leq 2V / 50 \Omega$ , when level > 2V		
	Others	Constant = OFF : Varies as range resistors Constant = 320X : 100 $\Omega \pm 5\%$ ; Constant = 107X : 25 $\Omega \pm 5\%$ Constant=106X : 100mA $\pm 5\%$ (1V setting); for inductive load less than 10 $\Omega$ , 10 $\Omega \pm 10\%$ , for impedance $\geq 10 \Omega$		
<b>Measurement Display Range</b>				
L, LK		0.00001 $\mu\text{H}$ ~9999.99H		
C		0.00001 pF~999.999mF		
Q, D		0.00001~99999		
Z, X, R		0.00001 $\Omega$ ~99.9999M $\Omega$		
Y		0.01nS~99.9999S		
$\theta$		-90.00°~ +90.00°		
DCR		0.01m $\Omega$ ~99.999M $\Omega$		
Turn,Ratio		0.01~99999.99 turns (Secondary voltage less than 100 Vrms)		
Ratio (dB)		-39.99dB~+99.99dB (seconding voltage less than 100 Vrms)		
Pin-Short		11 pairs, between pin to pin		
<b>Basic Accuracy</b>				
L, LK, C, Z, X, Y, R, DCR		0.1% (1kHz if AC parameter)		
Q, D		0.0005(1kHz)		
$\theta$		0.03°(1kHz)		
Turn, Ratio (dB)		0.5% (1kHz)		
<b>Measurement Speed (Fast)</b>				
L, LK, C, Z, X, Y, R, Q, D, $\theta$		80meas./sec.		
DCR		50meas./sec.		
Turn, Ratio (dB)		10meas./sec.		
<b>Judge</b>				
Transformer Scanning		PASS/FAIL judge of all test parameters output from Handler interface, 100 bin sorting for LK		
LCR METER		--	10 bins for sorting & bin sum count output from Handler interface/PASS/FAIL judge output from Handler interface	
<b>Trigger</b>		Internal, Manual, External		
<b>Display</b>		320x240 dot-matrix LCD display		
<b>Equivalent Circuit Mode</b>		Series, Parallel		
<b>Correction Function</b>		Open/Short Zeroing, Load correction		
<b>Memory</b>		15 instrument setups, expansion is possible via memory card		
<b>General</b>				
Operation Environment		Temperature:10°C~40°C, Humidity: 10%~90% RH		
Power Consumption		140 VA max.		
Power Requirement		90 ~ 132Vac or 180 ~ 264Vac, 47 ~ 63Hz		
Dimension (H x W x D)		177 x 430 x 300 mm / 6.97 x 16.93 x 11.81 inch		
Weight		9.2 kg / 20.26 lbs		

<b>Model</b>	<b>A132501</b>
<b>Standard Jig</b>	20 pins
<b>Test Contact pin</b>	Four terminals contact
<b>Control</b>	
Button	START, RESET
Indicators	GO, NG
<b>Solenoid Valve</b>	
Pressure	0.15~0.7Mpa(1.5~7.1kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>General</b>	
Operation Environment	Temperature: 10°C~40°C, Humidity: 10%~90% RH
Power Consumption	40 VA max.
Power Requirement	90 ~ 264Vac, 47 ~ 63Hz
Dimension (H x W x D)	90 x 270 x 220 mm / 3.54 x 10.63 x 8.66 inch
Weight	3.2 kg / 7.05 lbs

所有规格如有更动恕不另行通知。

自动  
化解决  
方案  
及  
太阳光  
电测试  
及  
半导  
体测试  
雷射  
二极  
体  
照  
明  
测  
试  
平  
面  
显  
示  
器  
视  
频  
与  
色  
彩  
自  
动  
光  
学  
检  
测  
电  
力  
电  
子  
测  
试  
被  
动  
元  
件  
测  
试  
电  
气  
安  
规  
测  
试  
通  
用  
及  
可  
靠  
度  
热  
电  
测  
试  
及  
量  
测  
制  
造  
资  
讯  
系  
统